

## SECCION G – FISICA

## G01 METROLOGIA; ENSAYOS

## G01Q TECNICAS O APARATOS DE SONDA DE BARRIDO; APLICACIONES DE TECNICAS DE SONDA DE BARRIDO, P. EJ. MICROSCOPIA POR SONDA DE BARRIDO [SMP] [2010.01]

Nota

En esta subclase se aplica la regla del primer lugar, es decir, en cada nivel jerárquico, salvo que se indique lo contrario, se clasifica en el primer lugar apropiado. [2010.01]

10/00	<b>Disposiciones para barrido o posicionamiento, es decir, disposiciones para controlar de forma activa el movimiento o posición de la sonda [2010.01]</b>	60/06	. . SNOM [Microscopía Óptica de Barrido en Campo Cercano] combinada con AFM [Microscopía de Fuerza Atómica] [2010.01]
10/02	. Barrido o posicionamiento basto [2010.01]	60/08	. . MFM [Microscopía de Fuerza Magnética] combinada con AFM [Microscopía de Fuerza Atómica] [2010.01]
10/04	. Barrido o posicionamiento fino [2010.01]	60/10	. STM [Microscopía de Efecto Túnel] o aparatos empleados, p. ej. sondas [2010.01]
10/06	. . Circuitos o algoritmos al efecto [2010.01]	60/12	. . STS [Espectroscopía de Efecto Túnel] [2010.01]
20/00	<b>Monitorización del movimiento o de la posición de la sonda [2010.01]</b>	60/14	. . STP [Potenciometría de Efecto Túnel] [2010.01]
20/02	. por medios ópticos [2010.01]	60/16	. . Sondos, su fabricación o su instrumentación relacionada, p. ej. soportes [2010.01]
20/04	. Sondos auto detectoras, es decir, en las que la sonda en sí misma genera una señal representativa de su posición, p. ej. galgas piezoeléctricas [2010.01]	60/18	. SNOM [Microscopía Óptica de Barrido en Campo Cercano] o aparatos empleados, p. ej. sondas SNOM [2010.01]
30/00	<b>Medios auxiliares destinados a asistir o mejorar las técnicas o aparatos de sonda de barrido, p. ej. dispositivos de visualización o de procesamiento de datos [2010.01]</b>	60/20	. . Fluorescencia [2010.01]
30/02	. Dispositivos de análisis de un tipo distinto al de microscopía de barrido [SPM], p. ej. microscopio electrónico de barrido [SME], espectrómetro o microscopio óptico [2010.01]	60/22	. . Sondos, su fabricación o su instrumentación relacionada, p. ej. soportes [2010.01]
30/04	. Dispositivos de visualización o de procesamiento de datos [2010.01]	60/24	. AFM [Microscopía de Fuerza Atómica] o aparatos empleados, p. ej. sondas AFM [2010.01]
30/06	. . para compensar el error [2010.01]	60/26	. . Microscopía de fuerza de fricción [2010.01]
30/08	. Medios para crear o regular las condiciones ambientales dentro de una cámara de muestras [2010.01]	60/28	. . Microscopía de fuerza de adhesión [2010.01]
30/10	. . Condiciones térmicas [2010.01]	60/30	. . Microscopía por barrido de potencial [2010.01]
30/12	. . En medio fluido [2010.01]	60/32	. . Modo AC [2010.01]
30/14	. . . En medio líquido [2010.01]	60/34	. . . Modo de contacto intermitente [2010.01]
30/16	. . Bajo vacío [2010.01]	60/36	. . Modo DC [2010.01]
30/18	. Medios para proteger o aislar el interior de una cámara de muestras de las condiciones ambientales externas, p. ej. vibraciones o campos electromagnéticos [2010.01]	60/38	. . Sondos, su fabricación o su instrumentación relacionada, p. ej. soportes [2010.01]
30/20	. Dispositivos o métodos para manejar las muestras [2010.01]	60/40	. . . Sondos conductoras [2010.01]
40/00	<b>Calibración, p. ej. sondas [2010.01]</b>	60/42	. . . Funcionalización [2010.01]
40/02	. Patrones de calibración o métodos para fabricarlos [2010.01]	60/44	. SICM [Microscopía de Barrido de Conductancia Iónica] o aparatos empleados, p. ej. sondas SICM [2010.01]
60/00	<b>Tipos particulares de microscopía por sonda de barrido [SPM] o aparatos empleados; Componentes esenciales al efecto [2010.01]</b>	60/46	. SCM [Microscopía de Barrido de Capacitancia] o aparatos empleados, p. ej. sondas SCM [2010.01]
60/02	. Microscopía por sonda de barrido [SPM] que emplea dos o más técnicas distintas [2010.01]	60/48	. . Sondos, su fabricación o su instrumentación relacionada, p. ej. soportes [2010.01]
60/04	. . STM [Microscopía de Efecto Túnel] combinada con AFM [Microscopía de Fuerza Atómica] [2010.01]	60/50	. MFM [Microscopía de Fuerza Magnética] o aparatos empleados, p. ej. sondas MFM [2010.01]
		60/52	. . Resonancia [2010.01]
		60/54	. . Sondos, su fabricación o su instrumentación relacionada, p. ej. soportes [2010.01]
		60/56	. . . Sondos con recubrimiento magnético [2010.01]
		60/58	. SThM [Microscopía Térmica de Barrido] o aparatos empleados, p. ej. sondas SThM [2010.01]
		60/60	. SECM [Microscopía Electroquímica de Barrido] o aparatos empleados, p. ej., sondas SECM [2010.01]

<b>70/00</b>	<b>Aspectos generales de las sondas SPM, de su fabricación o de su instrumentación relacionada, en tanto en cuanto no están adaptados a una única técnica SPM cubierta por el grupo G01Q 60/00 [2010.01]</b>	<b>70/16</b>	. Fabricación de las sondas [2010.01]
<b>70/02</b>	. Soportes de sondas [2010.01]	<b>70/18</b>	. . Funcionalización [2010.01]
<b>70/04</b>	. . con compensación de los errores causados por la temperatura o las vibraciones [2010.01]	<b>80/00</b>	<b>Aplicaciones de las técnicas de sonda de barrido distintas de la SPM</b> (fabricación o tratamiento de microestructuras B81C; fabricación o tratamiento de nanoestructuras B82B 3/00; grabación o reproducción de información empleando la interacción del campo próximo G11B 9/12, G11B 11/24 or G11B 13/08) [2010.01]
<b>70/06</b>	. Conjuntos de puntas de sondas [2010.01]	<b>90/00</b>	<b>Técnicas o aparatos de sonda de barrido no previstos en otro lugar [2010.01]</b>
<b>70/08</b>	. Características de las sondas [2010.01]		
<b>70/10</b>	. . Forma o conicidad [2010.01]		
<b>70/12</b>	. . . Puntas de nanotubos [2010.01]		
<b>70/14</b>	. . Materiales particulares [2010.01]		